



## KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu

Systemy i wzorce metrologiczne [S2ETI2>SiWM]

### Przedmiot

Kierunek studiów

Edukacja techniczno-informatyczna

Rok/Semestr

1/2

Studia w zakresie (specjalność)

–

Profil studiów

ogólnoakademicki

Poziom studiów

drugiego stopnia

Język oferowanego przedmiotu

polski

Forma studiów

stacjonarne

Wymagalność

obieralny

### Liczba godzin

Wykład

30

Laboratorium

0

Inne

0

Ćwiczenia

0

Projekty/seminaria

0

### Liczba punktów ECTS

2,00

### Koordynatorzy

dr hab. inż. Przemysław Głowacki  
przemyslaw.glowacki@put.poznan.pl

### Wykładowcy

### Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, elektrotechniki, elektroniki oraz matematyki. Umiejętność rozwiązywania elementarnych problemów z zakresu fizyki ogólnej, fizyki kwantowej, metrologii, umiejętność pozyskiwania informacji ze wskazanych źródeł. Zrozumienie konieczności poszerzania swoich kompetencji, gotowość do podjęcia współpracy w ramach zespołu.

### Cel przedmiotu

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny wzorców metrologicznych, w zakresie określonym przez treści programowe 2. Przedstawienie teorii i techniki wykonywania pomiarów 3. Wyjaśnienie zasad działania wybranych przyrządów i układów pomiarowych 4. Rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania prostych problemów w oparciu o uzyskaną wiedzę 5. Kształtowanie u studentów umiejętności samodzielnego kształcenia

### Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza:

definiować podstawowe pojęcia z dziedziny wzorców metrologicznych, w zakresie obejmowanym przez

Umiejętności:

-

Kompetencje społeczne:

-

## Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób:

Forma oceny test pisemny

Kryteria oceny: zgodnie z regulaminem studiów

Treści programowe

Podstawy metrologii, klasyfikację metod pomiarowych oraz historię i strukturę międzynarodowego układu jednostek SI. Omawiane są przyrządy i systemy pomiarowe różnych wielkości fizycznych oraz nowoczesne wzorce kwantowe, takie jak efekt Halla, zjawisko Josephsona czy detektory SQUID. Zajęcia poruszają także tematykę zegarów atomowych, ich działania i stabilności, a także zagadnienia interferometrii, pomiarów długości i współczesnych wzorców masy.

## Treści programowe

ma wiedzę w zakresie teorii i techniki pomiarów, przyrządów pomiarowych, zna i rozumie główne tendencje rozwojowe i najistotniejsze osiągnięcia w zakresie technik i technologii dotyczących systemów i wzorców metrologicznych

oszacować dokładność przyrządów pomiarowych oraz określać zakres pracy systemów pomiarowych oraz ich granice czułości, potrafi objaśnić budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń badawczych i pomiarowych

ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych, zaawansowanych zagadnień z fizyki, elektroniki i automatyki znajdujących zastosowania w nowoczesnych systemach i wzorcach metrologicznych

Umiejętności  
korzystać ze zrozumieniem ze wskazanych źródeł wiedzy (wykaz literatury podstawowej) oraz pozyskiwać wiedzę z innych źródeł (w tym angielskojęzycznych)

przeprowadzić proste obliczenia parametrów opisujących obiekt pomiarowy,

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z matematyki i fizyki do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z dziedziny metrologii

stosować właściwe metody i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, informatyczne oraz opracowania naukowe aby zaprojektować proste układy pomiarowe, dobrać odpowiednie sensory, przyrządy oraz określać ich dolne i górne zakresy pracy

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się i pogłębiania swojej wiedzy przez całe życie, potrafi inspirować inne osoby do procesu samokształcenia

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki i techniki

jest gotowy do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

## Tematyka zajęć

1. Wiadomości podstawowe o metrologii i pomiarach.

2. Pojęcie metody pomiarowej i klasyfikacja metod.

3. Historia systemów miar. Międzynarodowy układ jednostek Miar SI.

4. Ogólne informacje o narzędziach pomiarowych.

- przetworniki i przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych.

- mierniki analogowe i cyfrowe, multimetry,

- przyrządy rejestrujące (rejestratory, oscyloskopy analogowe, próbkujące i cyfrowe).

5. Systemy i wzorce: długości, masy, czasu, skale temperatury,

wzorce wielkości elektrycznych i źródła sygnałów wzorcowych,

6. Pomiary wielkości elektrycznych, magnetycznych oraz wielkości nie elektrycznych.

7. Kwantowy trójkąt metrologiczny.

8. Kwantowy wzorzec napięcia elektrycznego (nadprzewodnictwo, zjawisko Josephsona, kwantowy wzorzec napięcia).

9. Detektor strumienia magnetycznego (detektory rf-SQUID, dc-SQUID).
10. Kwantowy efekt Halla i wzorzec oporu (wzorzec klasyczny i kwantowy).
11. Zegary atomowe:
  - podstawy teoretyczne,
  - wariacja Allana,
  - atomowe cezowe wzorce częstotliwości z wiązką atomów cezu,
  - fontanna cezowa,
  - maser wodorowy,
  - rubidowy wzorzec częstotliwości,
  - optyczne wzorce częstotliwości (atomowe  $^{87}\text{Sr}$ ,  $^{171}\text{Yb}$ ,  $^{199}\text{Hg}$ , i jonowe  $^{27}\text{Al}^+$ ,  $^{40}\text{Ca}^+$ ,  $^{171}\text{Yb}^+$ ,  $^{88}\text{Sr}^+$ ),
  - optyczny grzebień częstotliwości,
  - nuklearny wzorzec częstotliwości ( $^{229}\text{Th}$ ).
12. Podstawy działania systemu zegara atomowego na przykładzie fontanny cezowej:
  - cykl pracy wzorca czasu i częstotliwości,
  - detekcja stosunku sygnału do szumu,
  - stabilność krótko czasowa,
  - procedura pomiarowa
13. Proces ewaluacji zaburzeń wpływających na częstotliwość przejścia zegarowego w atomowych, optycznych wzorcach czasu i częstotliwości:
  - przesunięcie dopplerowskie
  - przesunięcie starkowskie
  - przesunięcie zeemanowskie
  - promieniowanie ciała doskonale czarnego,
  - grawitacyjne przesunięcie ku czerwieni
  - przesunięcie zderzeniowe,
14. Skale czasu (GMT, UT, GPST, UTC, TAI,)
15. Systemy dystrybucji częstości wzorcowych (GPS, TWSTFT, TWIST, TTTOF)
16. Interferometry i pomiary długości (praktyczna realizacja metra, skaningowe mikroskopy próbkujące).
17. Wzorce masy:
  - wzorce zależne od stałej Plancka,
  - wzorzec masy z kulistej bryły krzemu,
  - wzorzec masy ze zliczaniem i akumulacją jonów)

## Metody dydaktyczne

Wykłady: wykład z prezentacją multimedialną (w tym: rysunki, zdjęcia, animacje, materiały video) uzupełniany przykładami podawanymi na tablicy, uwzględnianie różnych aspektów przedstawianych zagadnień, w tym: ekonomicznych, ekologicznych, prawnych i społecznych, przedstawianie nowego tematu poprzedzone przypomnieniem treści powiązanych, znanych studentom z innych przedmiotów.

## Literatura

Podstawowa:

1. W. Nawrocki: Wstęp do metrologii kwantowej. WPP, Poznań 2007
2. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki: Metrologia Elektryczna. Wydanie 8, WNT Warszawa 2003
3. S. Tumański: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007
4. R. Wynands and S. Weyers, Atomic fountain clocks, Metrologia 42 (2005) S64-S79
5. K. Szymaniec, S. E. Park, G. Marra and W. Chałupczak, First accuracy evaluation of the NPL-CsF2 primary frequency standard, Metrologia 47 (2010) 363-376

Uzupełniająca:

1. Mała encyklopedia metrologii, praca zbiorowa, WNT Warszawa 1989
2. J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski, Podstawy miernictwa, OWPW Warszawa 2002
3. W. Nawrocki, M. Wawrzyniak, Zjawiska kwantowe w metrologii elektrycznej, WPP, Poznań, 2003.
4. A. Derevianko, H. Katori, Colloquium: Physics of optical lattice clocks, Rev. Mod. Phys. 83, 331, (2011)
5. E. O. Göbel and U. Siegener, Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements, WILEY-VCH Weinheim 2015

## Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	50	2,00
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	30	1,00
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwiiw/egzaminu, wykonanie projektu)	20	1,00